

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2022]21 号

关于召开《硅片表面光泽度的测试方法》等 7 项半导体材料标准 网络工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及 2022 年标委会工作安排，现定于 2022 年 10 月 10 日~11 日召开半导体材料标准网络工作会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《硅片表面光泽度的测试方法》等 7 项半导体材料标准进行审定，具体项目见附件。请各标准项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议。各标准负责起草单位务必于 10 月 8 日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 10 月 9 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

二、会议时间

2022 年 10 月 10 日上午 9:00 开始。

三、会议参加方式

参会人员 在 “腾讯会议” 软件界面，点击 “加入会议”，输入会议 ID 及 “个人姓名-单位”，点击 “加入”，参加会议。

会议 ID 见附件。

四、联系方式

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

附件：审定项目表

二〇二二年九月二十七日



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

审定项目表

序号	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注	会议 ID
1	国标委发[2020]53 号 20204891-T-469	硅片表面光泽度的测试方法	浙江金瑞泓科技股份有限公司	审定	841-4161-3947
2	国标委发[2021]12 号 20210889-T-469	硅和锗体内少数载流子寿命的测定 光电导衰减法	有研半导体材料有限公司	审定	
3	国标委发[2021]12 号 20210890-T-469	用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程	青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司	审定	
4	国标委发[2021]12 号 20210891-T-469	多晶硅表面金属杂质含量测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法	亚洲硅业（青海）股份有限公司	审定	
5	中色协科字[2021]88 号 2021-021-T/CNIA	多晶硅生产固定污染源含氢排气中气态污染物采样方法	亚洲硅业（青海）股份有限公司	审定	
6	工信厅科函[2020]263 号 2020-1508T-YS	氮化镓化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法	国标（北京）检验认证有限公司	审定	
7	中色协科字[2021]88 号 2021-020-T/CNIA	硅片切割废料回收硅	中国科学院过程工程研究所	审定	